### 軟X線を用いた高エネルギー電子分布計測と 二次元画像再構成手法の開発

小野靖研究室 奥西 衛門

東京大学工学部工学部電気電子工学科

#### 目次<sup>·</sup>

- 1. 背景
- 2. 目的
- 3. 実験装置
- 4. 再構成原理
- 5. シミュレーション
- 6. TS実験結果
- 7. 結論

# 1.背景

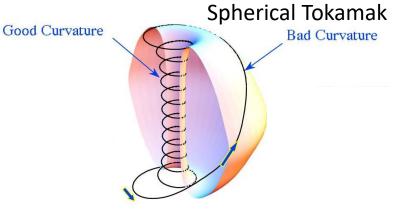
### 核融合と磁気リコネクション

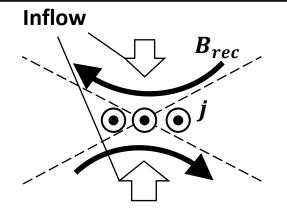
究極の次世代エネルギー源

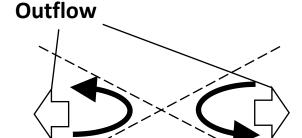
 $D + T \rightarrow He(3.5MeV) + n(14.1MeV)$ 

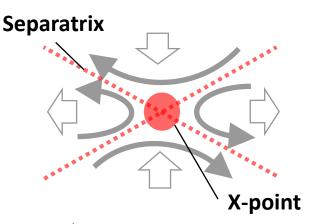
十分なプラズマ加熱が課題

磁力線のつなぎ替わり過程:Sweet-Parkerモデル







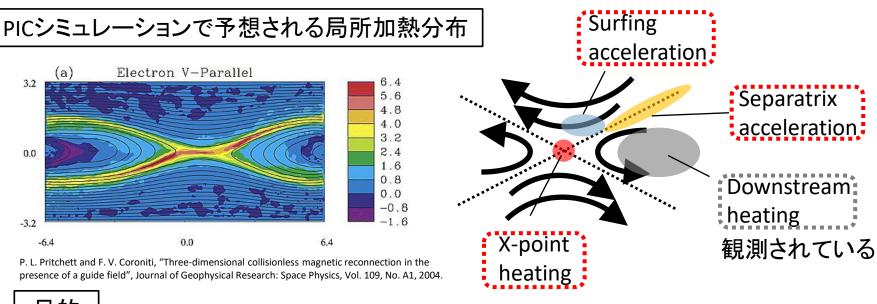


再結合磁場のエネルギーの一部が,荷電粒子の熱・運動エネルギーに変換される:

- アルヴェン速度に近いアウトフローによるプラズマ加速(イオン)
- 電流シート電界によるプラズマ加速とオーム加熱(電子)

# 2.目的

## リコネクションによる電子の局所加熱



目的

加熱領域が最大であるダウンストリーム加熱に加えて、未知の小さな加熱である X点加熱、セパラトリクス加熱、波乗り加速を観測し、加熱機構を解明したい。



従来より解像度の高い再構成手法の開発

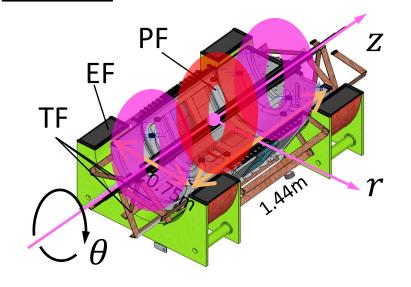
X線によるエネルギー別の電子密度測定 静電プローブによる電子温度,電子密度計測 本日の発表

今後に予定

# 3.実験装置

## プラズマ合体装置TS-6

TS-6断面



大円周方向(トロイダル方向)と 小円周方向(ポロイダル方向)に磁場を印加

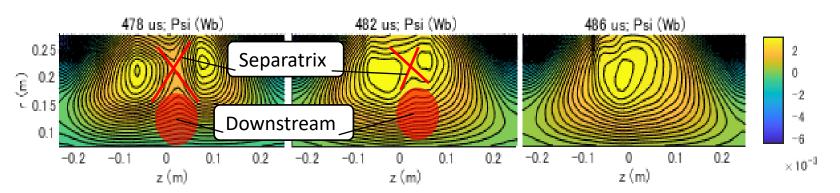


z+,z - それぞれの領域に トーラスプラズマを生成

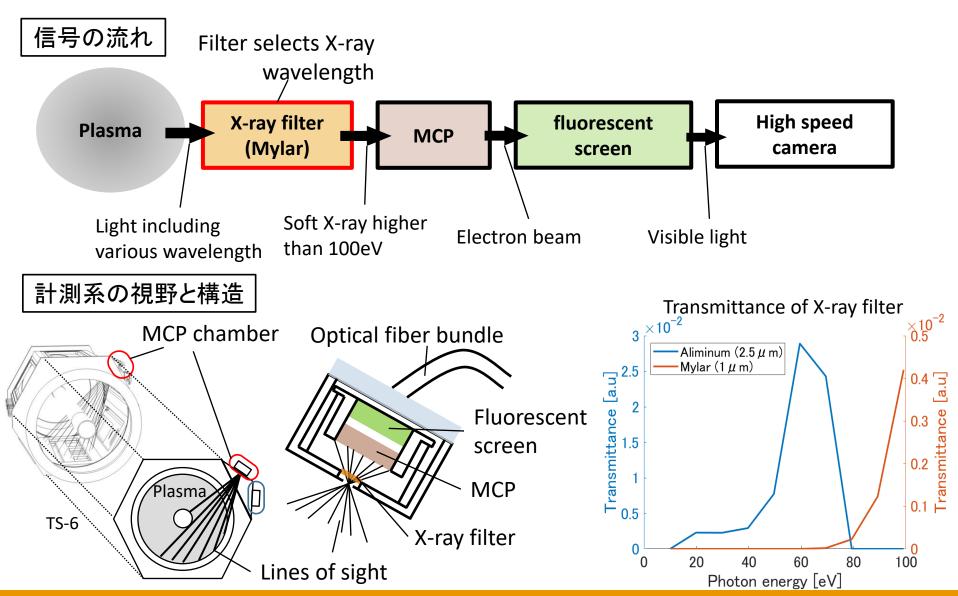


中間部z=0において合体

### ポロイダル断面の磁場分布 | 黒線は磁力線



## 開発中の多視点軟X線ステレオカメラ



# 4.再構成原理

## 正則化による偽ピークの抑制

プラズマの軸対称性を仮定し、二次元ラドン変換によって再構成を行う:

観測信号 
$$g = Hf + e$$
 雑音   
重み行列 再構成対象

ペナルティ関数正則化法は、以下の量Qを最小化するfを再構成像として選択する:

$$Q(f) = (粗さ) + (二乗誤差) = \gamma P(f) + \frac{1}{M} ||Hf - g||^2$$

Tikhonov-Phillips正則化法(線形再構成)

$$P(f) \rightarrow \int_{D} |\nabla^{2} f(r)|^{2} dr \sim |Cf|^{2}$$
 未定乗数法より,  $\hat{f} = (H^{T}H + M\gamma C^{T}C)^{-1}H^{T}g$ 

最小Fishier情報量法(非線形再構成)

$$P(f) \to \int_D \frac{|\nabla^{\mathrm{n}} f(r)|^2}{f(r)} dr$$

 $f \sim 0$ において強い正則化 $\rightarrow$  誤差による偽ピークの抑制

$$f^{(n+1)} = \left(H^T H + M \gamma C^T W^{(n)} C\right)^{-1} H^T g$$
  $W_{i,j}^{(n)} = rac{\delta_{i,j}}{f_i^{(n)}} for \ f > 0;$   $W_{i,j}^{(n)} = W_{max} for \ f \leq 0;$ 

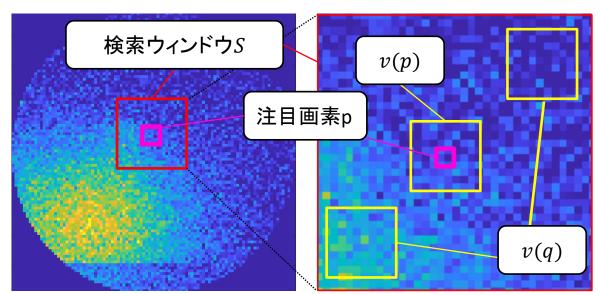
## フィルタリングによるノイズの低減

非線形平均(NLM)フィルタ

注目画素pに対して検索ウィンドウSを定め、S中の画素qの重み付けを行う:

$$p \to \Sigma_{q \in S} w(p,q) * q$$

$$w(p,q) = \frac{1}{Z(p)} \exp\left(-\frac{\max\left(\left||v(p)-v(q)|\right|^2 - 2\sigma^2, 0\right)}{\sigma^2}\right), (Zは規格化定数)$$

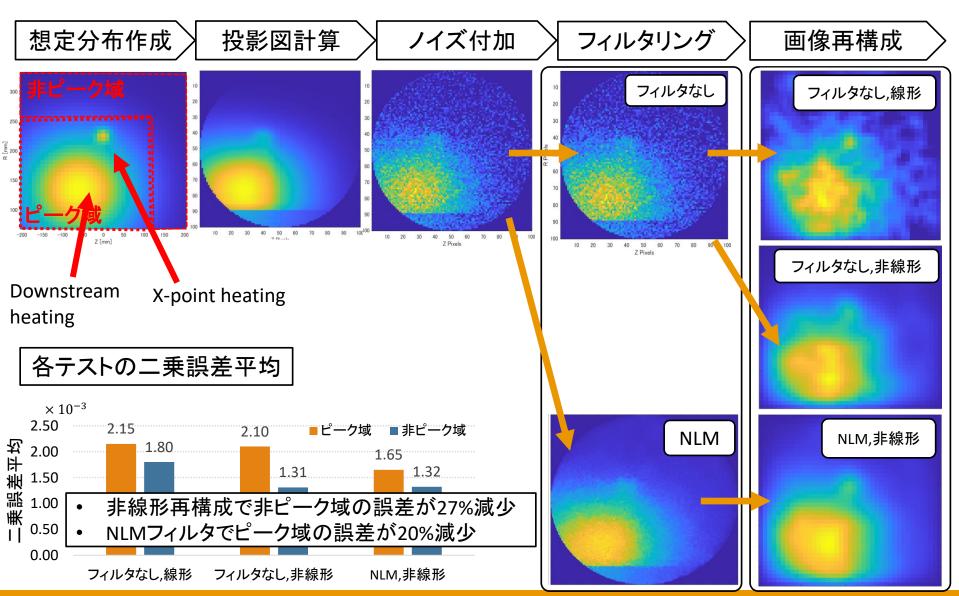


小さな加熱のスムージングを抑えな がらノイズを低減することが期待でき る

- 類似度の高い画素に大きな重み
- ノイズの分散 $\sigma^2$ の推定が必要
- エッジ保存型フィルタ

## 5.シミュレーションによる評価

## フィルタリングと非線形再構成の有効性

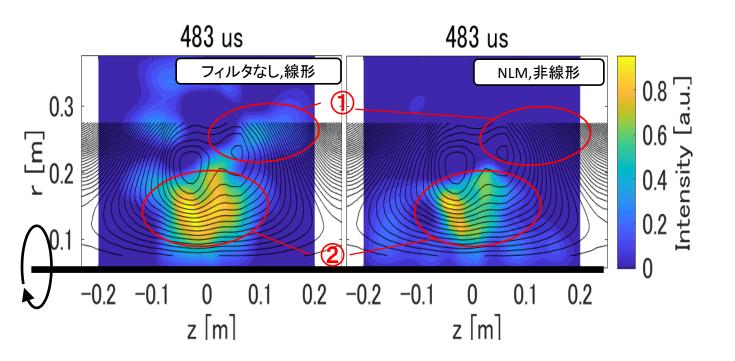


## 6.実験における再構成結果

## 新手法による改善(1):局所判別性の向上

従来手法との比較

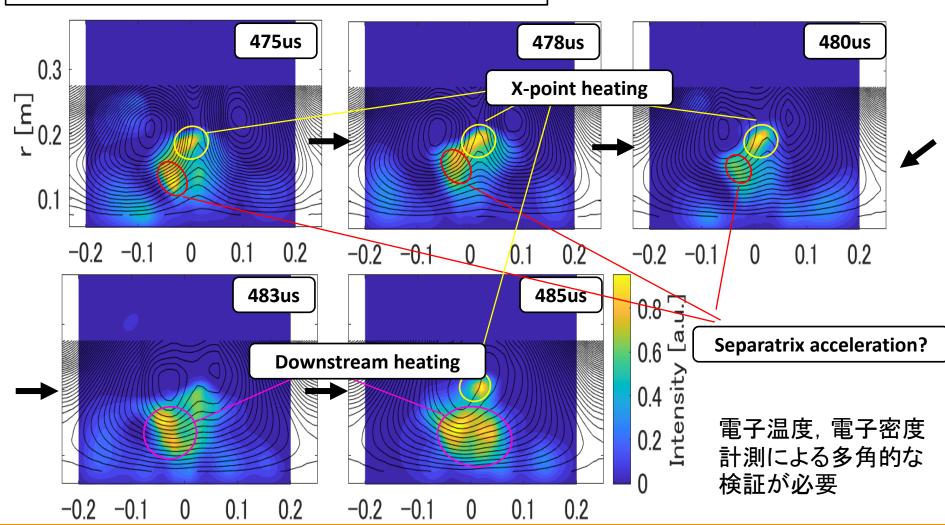
黒線は磁力線, 色は発光分布を表す; TF4kV, PF38kV: Mylar 1μm



- ① 偽ピークの低減:X点付近まで広がっていた発光が抑えられている
- ② 判別性の改善:ダウンストリーム加熱の大きなピークの中でも, z軸負の領域が高温である ことが見て取れる

## 新手法による改善(2):局所加熱の検出

フィルタと非線形再構成による時間発展:Mylar 1μm



# 7.結論

## 結論

#### 従来より解像度の高い再構成手法を開発

- 最小Fisher情報量を用いた非線形再構成がオフ ピーク領域の再構成誤差を27%低下させる
- NLMフィルタがピーク領域の再構成誤差を20%低下 させる

#### 今後の研究

再構成ソフトウェアの空間分解能試験

• ピーク幅とノイズS/Nの影響

静電プローブによる電子温度, 電子密度計測

• トリプルプローブの作成

X線によるエネルギー別の電子密度測定

X線フィルタの厚さをパラメータとしたスキャン

MCPの増設による6視点X線計測

フィルタなし,線形 NLM,非線形 0.8 「ne of the property of

お聞きいただきありがとうございました。

# 8.補足

## 再構成原理(1): 非線形再構成

重み行列Hの決定

i番目の投影像画素に対するj番目の分布画素の重みを $H_{ij}$ にもつ行列Hは、視線を点列とみなしたときの、画素中に含まれる点の数によって決定する。

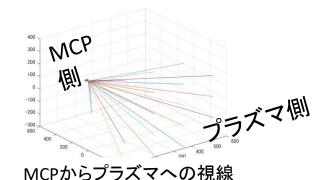
正則化パラメータγの決定:最小GCV基準

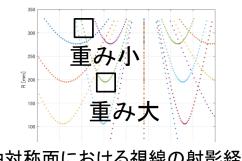
γは次の量が最小になる値に定める:

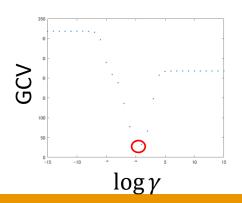
$$GCV(\gamma) = \frac{\epsilon}{1 - \frac{1}{M} \sum \frac{\sigma_i^2}{\sigma_i^2 + \gamma M}}$$

 $\gamma$ が大きすぎると二乗誤差 $\epsilon$ が増加, GCVが増大

 $\gamma$ が小さすぎると分母がOに近づき、GCVが増大







### 再構成原理(2):非線形平均フィルタ

ノイズの標準偏差の推定: John Immerkærの方法

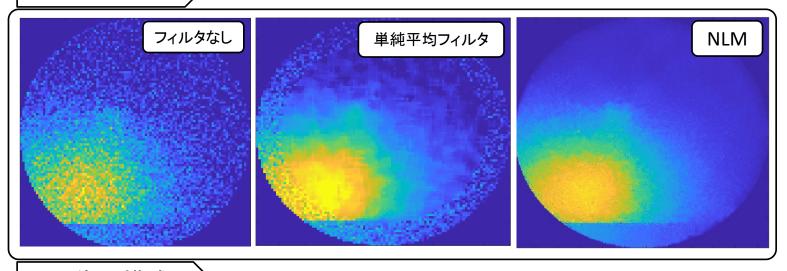
画像のエッジに対して不感となるノイズ推定作用素Nを考える

各ピクセルのノイズがもつ標準偏差 $\sigma_n$ を推定する

$$I_{xy} * N \equiv \sum_{\substack{j=-1,0,1\\i=-1,0,1}} I(x+i,y+j) * N_{ij}$$
$$\sigma_n^2 = \frac{\sum (I_{xy} * N)^2}{36(W-2)(H-2)}$$

## ファントムテスト: 単純平均フィルタ

#### フィルタリング



#### 画像再構成

